

適用規格					
定格	使用温度範囲	(注1) -40 °C ~ +105 °C	保存温度範囲	-40 °C ~ +105 °C	
	電流	1 A	電圧	AC 250 V	
性能					
	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認。		○	○
電気的 性能	接触抵抗	DC 1Aで測定する。	信号:30mΩ以下、外部:60mΩ以下	○	-
	低電圧、低電流下の接触抵抗	AC 20mV以下、0.1mA (DC 又は 1000 Hz) で測定する。	信号:30mΩ以下、外部:60mΩ以下	○	-
	絶縁抵抗	DC 500Vで測定する。	100 MΩ以上	○	-
	耐電圧	AC 650Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	-
機械的 性能	繰り返し動作	30 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐振性	周波数20~200 Hz, 加速度43.1 m/s ² で3方向 3 時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐衝撃性	振動数20~50Hz、加速度66.6m/s ² で1時間試験する。	① 10 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	ロック強度	98N以下の引張力をかん合軸方向に加える。	① 印加中十分結合していること。 ② 印加後結合部などに異常がないこと。	○	-
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度60°C、湿度90~95%中に500時間放置する。	① 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	熱衝撃	温度-40°C→常温→85°C→常温 時間 30→5→30→5分 を1000サイクル試験する。	① 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ② 絶縁抵抗: 100 MΩ以上 ③ 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐熱性	温度105°C中に1000時間放置する。	① 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐寒性	温度-40°C中に1000時間放置する。	① 接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆがみがないこと。	○	-
	耐亜硫酸ガス性	濃度500ppm、8時間放置する	接触抵抗: 信号60mΩ以下、外部120mΩ以下	○	-
	はんだ耐熱性	指定温度プロファイルでリフロー2回通す。	外観の変形及び端子などに著しいガタがないこと。	○	-
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
備考	注1. 通電時の温度上昇を含む。 注2. 適合基板は1.6 [mm]			承認	20200416
				検図	20200415
				担当	20200325
				製図	20200324
注	QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC-169398-58-00	
HRS	製品規格表		製品名	GT17HN2-4DP-2H (C) (58)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL767-0295-1-58	△ 1/1